



MATERIA

**INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA
MATERIA (IEM - CFMAC)**



MICROSCOPIO DE FUERZAS ATÓMICAS

El Microscopio de Fuerzas Atómicas (AFM) utiliza una palanca con una punta de dimensiones nanométricas que se desplaza sobre la superficie de un material revelando su topografía. El uso de palancas conductoras facilita la aplicación de campos eléctricos con los que realizar medidas de conductividad eléctrica (CFM) o de polarización (PFM) a la vez que se obtiene la imagen. También puede evaluarse la deflexión de la palanca para caracterizar las propiedades mecánicas del material (QNM). En el IEM, el grupo SOFTMATPOL opera un equipo Multimode 8 AFM y un controlador Nanoscope V (Bruker) para medidas de AFM, CFM, PFM y QNM.

<http://www.iem.csic.es/laboratorios.html>